

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19052-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 21.10.2022

Ausstellungsdatum: 21.10.2022

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Instrument Systems GmbH

Mit seinem Prüflaboratorium

**Instrument Systems GmbH
Kastenbauerstraße 2, 81677 München
Kaiserin-Augusta-Allee 16-24, 10533 Berlin**

Das Prüflaboratorium erfüllt die Mindestanforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 und gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, um die nachfolgend aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

Lichttechnik

Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

**Vor Ort *) nur Prüfungen an Display-Mess-Systemen (DMS) und Photometern der Firma
Instrument Systems GmbH
Standort München**

Fachbereich	Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand	Titel der Norm oder des Prüfverfahrens	Prüfbereich / Einschränkungen zum Prüfverfahren
Lichttechnik	CIE 63:1984	Spektroradiometrische Messungen an Lichtquellen The spectroradiometric measurement of light sources	- spektrale Bestrahlungsstärke von 200 nm bis 2500 nm - Lichtstrom, Teillichtstrom und spektrale Strahlungsleistung im Wellenlängenbereich von 360 nm bis 1100 nm Auch Prüfungen vor Ort*) - Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1100 nm
Lichttechnik	ISO 23539:2005	Photometrie - Das CIE-System der physikalischen Photometrie	- Lichtstrom und spektrale Strahlungsleistung im Wellenlängenbereich von 360 nm bis 1100 nm Auch Prüfungen vor Ort*) - Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1100 nm
	CIE S 010:2004	Photometry - The CIE System of Physical Photometry	
Lichttechnik	DIN 5032-1:1999	Lichtmessung - Teil 1: Photometrische Verfahren	Auch Prüfungen vor Ort*) - Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1100 nm

Fachbereich	Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand	Titel der Norm oder des Prüfverfahrens	Prüfbereich / Einschränkungen zum Prüfverfahren
Lichttechnik	DIN EN 13032-1:2012	Licht und Beleuchtung - Messung und Darstellung photometrischer Daten von Lampen und Leuchten	- spektrale Bestrahlungsstärke von 200 nm bis 2500 nm - Lichtstrom und spektrale Strahlungsleistung im Wellenlängenbereich von 360 nm bis 1100 nm Auch Prüfungen vor Ort*) - Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1100 nm
Lichttechnik	CIE 202:2011	Bestimmung der spektralen Empfindlichkeitsverteilung von Detektoren, Radiometern und Photoempfängern Spectral responsivity measurement of detectors, radiometers and photometers	Prüfung der spektralen Empfindlichkeit von Photodetektoren.
Lichttechnik	CIE 84:1989	Lichtstrommessung The measurement of luminous flux	Lichtstrom
Lichttechnik	CIE 239:2020	Goniospektrometrie von optischen Strahlungsquellen Goniospectroradiometry of Optical Radiation Sources	Strahlungsleistung und Lichtstrom
Lichttechnik	CIE:127:2007	LED Messungen Measurement of LEDs	- mittlere Lichtstärke für LEDs (ILED A und ILED B)
	CIE S025:2015	Testmethode für LED-Lampen, LED-Leuchten und LED-Module Test method for LED lamps, LED luminaires and LED modules	- Lichtstrom und Strahlungsleistung für LEDs

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19052-01-00

Fachbereich	Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand	Titel der Norm oder des Prüfverfahrens	Prüfbereich / Einschränkungen zum Prüfverfahren
Lichttechnik	ISO/CIE 11664-1:2019 DIN EN ISO 11664-1:2020	Farbmetrik - Teil 1: CIE farbmetrische Normalbeobachter	Auch Prüfungen vor Ort*) Tristimuluswerte X,Y,Z und die von diesen durch Berechnung ableitbaren Farbmessgrößen
	CIE S 014-1:2006	Colorimetry — Part 1: CIE Standard Colorimetric Observers	
Lichttechnik	ISO 11664-2:2007 DIN EN ISO 11664-2:2011	Farbmetrik - Teil 2: CIE Normlichtarten	Tristimuluswerte X,Y,Z und die von diesen durch Berechnung ableitbaren Farbmessgrößen
	CIE S 014-2:2006	CIE Standard Illuminants for Colorimetry	
Lichttechnik	ISO/CIE 11664-3:2019 DIN EN ISO 11664-3:2020	Farbmetrik - Teil 3: CIE-Farbwerte	Auch Prüfungen vor Ort*) Tristimuluswerte X,Y,Z und die von diesen durch Berechnung ableitbaren Farbmessgrößen
	CIE S 014-3:2011	Colorimetry - Part 3: CIE tristimulus values	
Lichttechnik	ISO/CIE 11664-5:2016	Farbmetrik - Teil 5: CIE 1976 L*u*v*-Farbenraum und gleichabständige u', v'-Farbtafel	Auch Prüfungen vor Ort*) Tristimuluswerte X,Y,Z und die von diesen durch Berechnung ableitbaren Farbmessgrößen
	DIN EN ISO 11664-5:2017	Colorimetry — Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour Space and u', v' Uniform Chromaticity Scale Diagram	

Standort Berlin

Fachbereich	Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand	Titel der Norm oder des Prüfverfahrens	Prüfbereich / Einschränkungen zum Prüfverfahren
Lichttechnik	CIE 63:1984	Spektroradiometrische Messungen an Lichtquellen The spectroradiometric measurement of light sources	Auch Prüfungen vor Ort*) - Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1100 nm
Lichttechnik	DIN 5032-1:1999	Photometrische Verfahren	- Lichtstärke Auch Prüfungen vor Ort*) - Beleuchtungsstärke Auch Prüfungen vor Ort*) - Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1100 nm
Lichttechnik	DIN EN 13032-1:2012	Licht und Beleuchtung - Messung und Darstellung photometrischer Daten von Lampen und Leuchten	Auch Prüfungen vor Ort*) - Beleuchtungsstärke
Lichttechnik	DIN 5032-2:1992	Lichtmessung, Betrieb elektrischer Lampen und Messungen der zugehörigen Größe	- Lichtstärke Auch Prüfungen vor Ort*) - Beleuchtungsstärke
Lichttechnik	ISO 23539:2005	Photometry - The CIE System of Physical Photometry	- Lichtstärke Auch Prüfungen vor Ort*) - Beleuchtungsstärke
	CIE S 010:2004		Auch Prüfungen vor Ort*) - Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1100 nm

Fachbereich	Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand	Titel der Norm oder des Prüfverfahrens	Prüfbereich / Einschränkungen zum Prüfverfahren
Lichttechnik	ISO 11664-1:2019 DIN EN ISO 11664-1:2011	Farbmetrik - Teil 1: CIE farbmetrische Normalbeobachter	Auch Prüfungen vor Ort*) Tristimuluswerte X,Y,Z und die von diesen durch Berechnung ableitbaren Farbmessgrößen
	CIE S 014-1:2006	Colorimetry — Part 1: CIE Standard Colorimetric Observers	
Lichttechnik	ISO 11664-2:2007 DIN EN ISO 11664-2:2011	Farbmetrik - Teil 2: CIE Normlichtarten	- Lichtstärke - Beleuchtungsstärke
	CIE S 014-2:2006	CIE Standard Illuminants for Colorimetry	
Lichttechnik	ISO 11664-3:2012 DIN EN ISO 11664-3:2013	Farbmetrik - Teil 3: CIE-Farbwerte Colorimetry - Part 3: CIE tristimulus values	Auch Prüfungen vor Ort*) Tristimuluswerte X,Y,Z und die von diesen durch Berechnung ableitbaren Farbmessgrößen
	CIE S 014-3:2011		
Lichttechnik	ISO/CIE 11664-5:2016 DIN EN ISO 11664-5:2017	Farbmetrik - Teil 5: CIE 1976 L*u*v*-Farbenraum und gleichabständige u', v'-Farbtafel Colorimetry — Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour Space and u', v' Uniform Chromaticity Scale Diagram	Auch Prüfungen vor Ort*) Tristimuluswerte X,Y,Z und die von diesen durch Berechnung ableitbaren Farbmessgrößen

Vor Ort *) nur Prüfungen an Display-Mess-Systemen (DMS) und Photometern der Firma Instrument Systems GmbH